

Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych

Autor : Jolanta Gębicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Usługi Pracowni

- Wzorcowanie wzorców (achromatycznych i barwnych) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D w odniesieniu do wzorca pierwotnego
- Wzorcowanie wzorców (achromatycznych) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D w odniesieniu do wzorca wtórnego
- Wzorcowanie wzorców (achromatycznych i barwnych) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ w odniesieniu do wzorca pierwotnego
- Wzorcowanie wzorców (achromatycznych) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ w odniesieniu do wzorca wtórnego
- Wzorcowanie wzorców długości fali w odniesieniu do wzorca pierwotnego
- Wzorcowanie wzorców długości fali w odniesieniu do wzorca wtórnego
- Wyznaczenie wartości składowych trójchromatycznych (X , Y , Z) i współrzędnych chromatyczności (x , y) na podstawie wyników pomiarów widmowego współczynnika przepuszczania wzorców barwnych
- Wzorcowanie spektrofotometrów (dla gęstości optycznej widmowego

współczynnika przepuszczania kierunkowego D)

- Wzorcowanie spektrofotometrów (dla widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ)
- Wzorcowanie spektrofotometrów (dla długości fali)

[Stanowiska pomiarowe](#)

[Kontakt do Pracowni](#)